

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	1 RE-F-09600	中村	山口	04.03.22	△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲	-10℃～60℃(注2)			
	電圧	AC 125 V			使用湿度範囲	40%～80%			
	電流	0.5 A			保存湿度範囲	40%～70%(注2)			
性能									
	項目	試験方法			規格			QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電気的 性能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			30 mΩ以下			○	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で 測定する。			30 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。			1000 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機械的 性能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、全振幅 1.5 mm、 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	温度サイクル	温度 -65→+15→+35→+125→+15→+35℃ 時間 30→MAX 5→30→MAX 5 分 を 5 サイクル試験する。▲						○	—
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下			○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、120 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間			外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。			○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3℃、浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	—
備考					製図	担当	検図	承認	出図
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。					HIF 04.02.20 中村	HIF 04.02.20 中村	HIF 04.02.20 山口	HIF 04.02.23 大川	
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表		製品名 HIF6B-**-PA-1.27DS(71)		
旧CL CL		図番 SLC4-082799-21		製品コード CL631			1 1		

